

表面汚染密度測定について

No.	Page	質問・コメント等
10	本文 P16,17 (表面汚染密度)	表面汚染密度測定について、審査基準では不確かさを含めて評価することとなっているため、不確かさを考慮しても0.8Bq/cm ² を下回る測定ができることの説明を追記すること。

今回の認可申請書に記載した放射能確認対象物の表面汚染密度（⁶⁰Co相当：以下、⁶⁰Co相当の表面汚染密度は「⁶⁰Co相当」の記載を省略する。）の測定方法は、当初、前回の認可申請書同様に表面汚染密度が0.8Bq/cm²未満であることを確認可能であり、放射能濃度換算係数における表面汚染密度の設定値を0.8Bq/cm²を用いるとしていたが、審査基準において不確かさに関する要求が明確になったことを考慮し再検討した結果、不確かさを考慮した表面汚染密度は1.3Bq/cm²未満であることから、放射能濃度換算係数における表面汚染密度の設定値は1.3Bq/cm²とする。

以下の測定手順や測定条件は、不確かさを考慮しない場合の**検出限界値が0.8Bq/cm²未満となるように定めており**、線源を用いた実証試験によりその妥当性について確認している。また不確かさを考慮した場合の表面汚染密度の最大値は1.3Bq/cm²未満であることから、放射能換算係数における表面汚染密度の設定値を1.3Bq/cm²とする。以下にその詳細を示す。

1. 表面汚染密度の測定の手順

表面汚染密度の測定方法として、放射線測定装置にて放射能濃度確認対象物の全面に対して走査させ、スクリーニングを行う。スクリーニングにて、表面汚染の可能性が有ると判断した部位については、放射線測定装置を静止させて詳細サーベイを行い、表面汚染の有無を判断する。

表面汚染密度の測定手順の詳細は、以下のとおり。

<事前準備>

- 放射線測定装置が校正期限内であり機器効率、使用環境が基準を満足していることを確認し、日常点検を行う。

<BG測定>

- 放射線測定場所にてBG値が基準を満足していることを確認する。

<スクリーニング>

- GM管式サーベイメータ（以下、「GM管」という。）、プラスチックシンチレーション式サーベイメータ（サーベイメータ型）（以下、「βシンチ」という。）及びプラスチックシンチレーション式サーベイメータ（据置型）（以下、「据置型」という。）を用いて、放射能濃度確認対象物の全面に対して走査させ直接測定法を行う。
- GM管及びβシンチは、放射線測定装置と放射能濃度確認対象物の表面との距離は

5mm 以内とする。(据置型は、30mm 以内となるよう検出器が上下に移動する。)
(放射線測定装置の校正時の標準線源 (^{60}Co) との距離と同じ)

- ・ GM 管及び β シンチは、放射線測定装置と放射能濃度確認対象物の表面との距離が 5mm を超える場合は、間接測定法にて測定を行う。(据置型は、凹凸がない平らな物のみ)
- ・ GM 管及び β シンチは、判定値 (スクリーニングから詳細サーベイに移行する計数率) を上回る値を計測した場合、その部位について静止させて詳細サーベイを行う。(据置型は検出限界値を上回った場合、自動停止する。)

< 詳細サーベイ >

- ・ 詳細サーベイは GM 管又は β シンチを静止させ測定を行い、BG 値に応じた検出限界計数率以上を計測した場合、その部位については安全側に $0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ 未満であったとしても表面汚染があるものと判断し、除染を行う。
- ・ BG 値に応じた検出限界計数率未満となった場合、その部位については $0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ 以上の表面汚染がないものと判断し、スクリーニングを再開する。

< 間接測定法 >

- ・ 間接測定法は、スミア紙を用いて測定対象物の全面を 100cm^2 毎拭き取る。拭き取り効率 0.1 としてスミア紙を GM 管にて測定する。BG 値に応じた検出限界計数率以上を計測した場合、その部位については安全側に $0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ 未満であったとしても表面汚染があるものと判断し、除染を行う。

2. 具体的な測定条件及び検出限界値

表面汚染密度測定の測定条件及び検出限界値の算出式を本回答書の表-1 に示し、また検出限界値の算出結果を本回答書の表-2 に示す。

- ・ GM 管及び β シンチを用いた直接測定法によるスクリーニングにおける詳細サーベイへ移行する判定値は検出限界計数率以下で管理する自主的な運用として定めた値である。この計数率に相当する表面汚染密度は $0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ 未満であることを確認した。また、測定に関する主な不確かさについて、計数率と機器効率に関する不確かさを考慮する。計数率は不確かさとして標準偏差の 1.645 倍を加えた計数率とする。機器効率は線源と検出器の距離の最大値を考慮して設定する。計数率と機器効率の不確かさを考慮した表面汚染密度は、 $1.3\text{Bq}/\text{cm}^2$ 未満であることを確認した。
(上記のとおり、機器効率は不確かさを考慮している値を設定しているため、以降では、計数率の不確かさのみを記載する。)
- ・ GM 管及び β シンチを用いた詳細サーベイにおける検出限界値、また GM 管を用いた間接測定法における検出限界値は $0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ 未満である。また、不確かさを考慮した表面汚染密度の値 (検出限界計数率に標準偏差の 1.645 倍を加えた計数率に相当する値) は、 $1.3\text{Bq}/\text{cm}^2$ 未満であることを確認した。
- ・ 据置型では、BG 基準値を設定していないが、機器効率及び BG 値に応じた検出限界計数率における検出限界値が $0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ 以上となると自動停止する。据置型は自

動判定のため BG 値及び機器効率に応じた検出限界値となる。BG 値を 0～50cps の範囲でそれぞれ検出限界計数率を求める。求めた検出限界計数率を検出値と扱い、検出限界計数率に標準偏差の 1.645 倍を加えた計数率に相当する表面汚染密度の値を求めた結果、最大で 1.24Bq/cm²であり 1.3Bq/cm²未満であることを確認した。

- ・以上より、GM 管、βシンチ及び据置型を用いた上記の表面汚染密度の測定手順及び測定条件において、不確かさを考慮した表面汚染密度の値は、1.3Bq/cm²未満である。

3. 実証試験について

実際に 0.8Bq/cm²の汚染を検出できることを以下のとおり実証試験を実施し確認した。

試験方法は以下のとおり

- ・ Ge 半導体検出器にて放射エネルギーを定量した放射性物質をステンレス皿に滴下、乾燥させ 0.6Bq/cm² (①)、0.7Bq/cm² (②)、0.8Bq/cm² (③) の実証試験用試料を各 1 枚作成。
- ・ 汚染が付着していない実証試験用試料 (ダミー : 0Bq/cm²) (④) を 4 枚用意。
- ・ GM 管及びβシンチは、実際に現場で測定を行っている放射線管理員 10 名にてそれぞれ①、②、③及び④の 7 枚の実証試験用試料についてスクリーニングを行い、各実証試験用試料について汚染の有無を判断させる。
- ・ 据置型は、①、②及び③の 3 枚の実証試験用試料について測定を 10 回行い、各実証試験用試料について汚染の有無を判断させる。

結果、GM 管及びβシンチは、0.6Bq/cm²は 90%、0.7Bq/cm²及び 0.8Bq/cm²は 100%汚染の有の判断が可能であった。また据置型は 0.6Bq/cm²及び 0.7Bq/cm²は 50～60%、0.8Bq/cm²については 100%汚染の有の判断が可能であった。(詳細は別紙参照)

従って、すべての放射線測定装置において 0.8Bq/cm²の実証試験用試料を 100%汚染の有の判断が可能であったことから、表面汚染密度が 0.8Bq/cm²未満であることの確認は可能であると判断した。

4. まとめ

以上より、不確かさを考慮しない表面汚染密度 0.8Bq/cm²未満となり、これは、前回の認可申請書と同様であるが、審査基準において不確かさに関する要求が明確になったことを考慮し不確かさを考慮した放射能濃度換算係数における表面汚染密度の設定値は 1.3Bq/cm²を用いる。

<補足>

認可申請書に記載の表面汚染密度 ((本文) 表-10 二次的な汚染の調査結果 (汚染の程度) 等) は、2.2E-02Bq/cm²等、上述の値を大きく下回る。この表面汚染密度測

定の目的は、上述のような 0.8Bq/cm^2 未満であることの確認ではなく、汚染の程度の調査であり、表面汚染密度の測定方法が異なる。測定方法は上述の 0.8Bq/cm^2 未満であることを確認する方法ではなく、 β シンチを用いたスケーラモードによる 500 秒の静止測定である。このため、検出限界値が異なる。

以上

表-1 測定条件

放射線測定装置	検出器	GM 管式サーベイメータ		プラスチックシンチレーション式サーベイメータ	
	型	サーベイメータ型			据置型
	型式 (*1)	TGS-146B	TCS-316H	NLM22933-44195-A	
	略称	GM 管	β シンチ	据置型	
測定方法	直接測定法	間接測定法	直接測定法	直接測定法	
線源効率 (*2)	0.4	0.4	0.4	0.4	
機器効率 (*3)	0.30 以上	0.30 以上	0.38 以上	※1	
検出器の入射窓面積又は線源面積 (*4)	19.6cm ²	—	100cm ²	100cm ² ※2	
BG 測定	時定数	30 秒 (0.5 分)	30 秒 (0.5 分)	30 秒 (0.5 分)	—
	測定時間	90 秒	90 秒	90 秒	200 秒
	BG 基準値	100cpm 以下	100cpm 以下	500cpm 以下	※1
スクリーニング	時定数	3 秒 (0.05 分)	—	3 秒 (0.05 分)	※3
	走査速度・測定時間	1cm/秒	—	4cm/秒	2cm/秒
	検出器走査方向長さ (*5)	5cm (4.33cm)	—	5.9cm	31cm
	表面との距離	5mm	—	5mm	30mm
	拭き取り面積	—	—	—	—
	拭き取り効率	—	—	—	—
	検出限界計数率	30cpm※4	—	150cpm※4	※6
詳細サーベイ	時定数	10 秒 (0.17 分)	30 秒 (0.5 分)	10 秒 (0.17 分)	—
	測定時間	30 秒	90 秒	30 秒	—
	拭き取り面積 (*6)	—	100cm ²	—	—
	拭き取り効率 (*6)	—	0.1	—	—
	検出限界計数率	※5	※5	※5	—

*1：代表型式である。今後の製品開発に伴う変更はあり得る。

*2：線源効率は、「放射性表面汚染密度の評価における線源効率の実験研究（(財)電力中央研究所）」より ⁶⁰Co を滴下，乾燥させた金属材（アルミニウム，鉄材，鉛，ステンレス（みがき，粗面，水性ペイント），スミアろ紙（拭き取り））において 0.4 以上の結果を得ていることから 0.4 とした。

*3：機器効率は，線源と検出器の距離を考慮して設定する。具体的には，標準面線源と検出器表面との距離（5mm，30mm）を設けて機器効率を設定する。実際の表面汚染密度の測定では，これらの距離以下となるよう管理する。

*4：検出器の入射窓面積は機器仕様を基に設定する。また線源面積は JIS Z4504-3：2023 を参考に設定する。

検出器の入射窓面積に満たない領域の汚染は，検出器の入射窓面積あたりに

平均的に存在するものとし、表面汚染密度を算出する際、検出器の入射窓面積で除して算出する。

(放射能換算係数の設定における小領域あたりに含まれる表面積は、検出器の入射窓面積以上となるよう小領域の大きさを設定する。この際、検出器の入射窓面積が最大の 100cm² (βシンチ) を採用する。)

※5：GM 管は検出器の入射窓形状が円形であることから中心位置を外れた場合の走査方向長さを括弧内に記載する。

※6：JIS Z4504-2：2023 を参考に設定する。

※1：据置型は、機器効率及び BG 値に応じて検出限界値が自動計算され、0.8Bq/cm² を下回る値となることを自動で確認する。

※2：据置型の検出器の入射窓面積は、52cm×31cm である。

※3：スケーラ方式であり時定数を持たない。測定時間は 15.3 秒。

※4：GM 管及びβシンチを用いた直接測定法によるスクリーニングにおける詳細サーベイへ移行する判定値は検出限界計数率以下で管理する自主的な運用として定めた値である。

※5：BG 値に応じた検出限界計数率。

※6：検出限界値が 0.8Bq/cm² となる機器効率に応じた検出限界計数率。

- (1) GM 管及びβシンチの表面汚染密度の算出
 ア. 検出限界計数率の算出

$$Nd = \frac{k}{2} \left[\frac{k}{2Ts} + \sqrt{\left(\frac{k}{2Ts}\right)^2 + 2Nb \left(\frac{1}{Ts} + \frac{1}{Tb}\right)} \right]$$

- Nd : 検出限界計数率 (cpm)
 Nb : BG 計数率 (cpm)
 k : 標準偏差の倍数, 3 (-)
 Ts : 測定時の時定数 (分)
 Tb : BG 計数率測定時の時定数 (分)

- イ. 走査による指示率

$$Ev = 1 - \exp\left(-\frac{L/v}{ts}\right)$$

- Ev : 指示率 (-)
 L : 検出器走査方向長さ(cm)
 v : 走査速度(cm/秒)
 ts : 測定時の時定数(秒)

- ウ. 計数率 (cps) の標準偏差

$$\sigma = \sqrt{\sigma_n^2 + \sigma_b^2}$$

ここで

$$\sigma_n = \sqrt{\frac{n_s}{2ts}}$$

$$\sigma_b = \sqrt{\frac{n_b}{2tb}}$$

- σ : 計数率 (cps) の標準偏差 (cps)
 σ_n : 測定時の標準偏差 (cps)
 σ_b : BG 計数率測定時の標準偏差 (cps)
 n_s : 測定時のグロス計数率 (cps)
 ts : 測定時の時定数(秒)
 n_b : BG 計数率 (cps)
 tb : BG 計数率測定時の時定数(秒)

- エ. 不確かさを考慮した表面汚染密度

$$Ad = \frac{Nd + 1.645\sigma \times A}{S \times \epsilon_i \times \epsilon_s \times A \times Ev}$$

Ad : 表面汚染密度 (Bq/cm²)
 Nd : 判定値または検出限界計数率 (cpm)
 σ : 計数率 (cps) の標準偏差 (cps)
 S : 検出器の入射窓面積 (cm²)
 ϵ_i : 機器効率 (-)
 ϵ_s : 線源効率 (-)
 A : 分から秒への換算数, 60 (秒/分)
 Ev : 指示率 (-)

(2) 据置型の表面汚染密度の算出

ア. 検出限界計数率の算出

$$Nd = \frac{k}{2} \left[\frac{k}{Ts} + \sqrt{\left(\frac{k}{Ts}\right)^2 + 4Nb \left(\frac{1}{Ts} + \frac{1}{Tb}\right)} \right]$$

Nd : 検出限界計数率 (cpm)
 Nb : BG 計数率 (cpm)
 k : 標準偏差の倍数, 3 (-)
 Ts : 測定時間 (分)
 Tb : BG 測定時間 (分)

イ. 運用管理値

$$Ad' = \frac{Nd}{Ws \times \epsilon_i \times \epsilon_s \times A} < 0.8$$

Ad' : 検出限界値 (Bq/cm²)
 Nd : 検出限界計数率 (cpm)
 Ws : 線源面積 (cm²)
 ϵ_i : 機器効率 (-)
 ϵ_s : 線源効率 (-)
 A : 分から秒への換算数, 60 (秒/分)

ウ. 計数率 (cps) の標準偏差

$$\sigma = \sqrt{\sigma_n^2 + \sigma_b^2}$$

ここで

$$\sigma_n = \sqrt{\frac{Ns}{Ts}}$$

$$\sigma_b = \sqrt{\frac{N_b}{T_b}}$$

σ : 計数率 (cps) の標準偏差 (cps)

σ_n : 測定時の標準偏差 (cps)

σ_b : BG 計数率測定時の標準偏差 (cps)

N_s : 測定時のグロス計数率 (cps)

T_s : 測定時間(秒)

N_b : BG 計数率 (cps)

T_b : BG 測定時間(秒)

エ. 不確かさを考慮した表面汚染密度

$$Ad = \frac{Nd + 1.645\sigma \times A}{Ws \times \varepsilon_i \times \varepsilon_s \times A}$$

Ad : 検出限界値 (Bq/cm²)

Nd : 検出限界計数率 (cpm)

σ : 計数率 (cps) の標準偏差 (cps)

Ws : 線源面積 (cm²)

ε_i : 機器効率 (—)

ε_s : 線源効率 (—)

A : 分から秒への換算数, 60 (秒/分)

表-2 算出結果

直接測定法

放射線測定装置		GM 管	β シンチ
スクリーニング	判定値 (cpm)	30	150
	σ : 計数率の標準偏差 (cpm)	37.4	83.7
	判定値+1.645 σ (cpm) *	92	288
	判定値+1.645 σ (cpm) における 表面汚染密度 (Bq/cm ²)	0.85 *1	0.812
詳細サーベイ	検出限界計数率 (cpm)	75	148
	σ : 計数率の標準偏差 (cpm)	25.0	49.4
	検出限界計数率+1.645 σ (cpm) *2	116	230
	検出限界計数率+1.645 σ (cpm) における 表面汚染密度 (Bq/cm ²)	0.823	0.252

*1 : GM 管の検出の入射窓の形状は円形であることから、走査測定時に中心を外れ最も通過距離が短くなる位置における長さは 4.33cm (直径 $\times\cos 30^\circ$) である。不確かさを考慮した表面汚染密度の算出においては、走査による指示率における検出器走査方向長さは 4.33cm を用いる。

*2 : BG 計数率は、GM 管 : 100cpm, β シンチ : 500cpm の時の値

注) 検出限界計数率+1.645 σ (cpm) における表面汚染密度が、一番高くなるよう機器効率及び BG 基準値を設定して算出。

間接測定法

放射線測定装置		GM 管
100cm ² 拭き取り 測定	検出限界計数率 (cpm)	47
	σ : 計数率の標準偏差 (cpm)	15.7
	検出限界計数率+1.645 σ (cpm) *	73
	検出限界計数率+1.645 σ (cpm) における 表面汚染密度 (Bq/cm ²)	1.01

* : BG 計数率は、100cpm の時の値

注) 検出限界計数率+1.645 σ (cpm) における表面汚染密度が、一番高くなるよう機器効率及び BG 基準値を設定して算出。

据置型

BG 値 (cps)	0	10	20	30	40	50
機器効率 (%) *	1.84	8.85	12.1	14.6	16.7	18.6
検出限界計数率 (cps)	0.588	2.83	3.87	4.66	5.34	5.93
検出限界計数率+1.645 σ (cps)	0.911	4.38	5.98	7.22	8.26	9.18
検出限界計数率+1.645 σ における 表面汚染密度 (Bq/cm ²)	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.23

* : ある BG 値において検出限界値が 0.8Bq/cm²を満たす機器効率の計算上の下限値を示しており、実際には、点検校正時に線源試験により求めた機器効率（固定値）を用いる。

注) 据置型は自動判定のため BG 値及び機器効率に応じた事例を示す。

汚染測定の実証試験結果について

クリアランス制度を適用する解体撤去物の表面汚染密度の測定は、GM 管式サーベイメータ及びプラスチックシンチレーション式サーベイメータ（サーベイメータ型及び据置型）を用いる。社内規定において測定器の検出限界値が $0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ 未満となる測定条件の基、測定を実施することとしているが、検出限界値付近の表面汚染が存在した場合、当該汚染を検出できる確率は 50%である。

つまり、当該汚染を見逃す確率も 50%である。

そのため、 $0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ の汚染を確実に検出するために、 $0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ を十分に下回る検出限界値で表面汚染を測定する必要がある。

今回、実際に解体撤去物の表面汚染密度を測定する条件において、各測定器で $0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ 相当の表面汚染測定を実施し、検出の可否を確認した。

詳細な内容については、以下のとおり。

1 実証試験方法

(1) GM 管式サーベイメータ及びプラスチックシンチレーション式サーベイメータ（サーベイメータ型）

- ① 実証試験用試料を 7 枚 (0.6 , 0.7 , $0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ の汚染が付着した実証試験用試料を各 1 枚、汚染が付着していない実証試験用試料を 4 枚) を準備する。
- ② 測定器(管理区域内に配備している測定器で最も機器効率が低いもの)を準備する。
- ③ 7 枚の実証試験用試料に対して走査測定で測定し、汚染の検出の可否を確認する。

上記の方法を放射線管理員 10 名が実施した。

(2) プラスチックシンチレーション式サーベイメータ（据置型）

- ① 実証試験用試料を 4 枚 (0.4 , 0.6 , 0.7 , $0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ の汚染が付着した実証試験用試料を各 1 枚) 準備する。
- ② プラスチックシンチレーション式サーベイメータ（据置型）の各検出器において、検出感度が最も悪い箇所に実証試験用試料を配置する。
- ③ 走査測定： $20\text{mm}/\text{秒}$ では 0.6 , 0.7 , $0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ の実証試験用試料、走査速度： $10\text{mm}/\text{秒}$ では 0.4 , 0.6 , 0.7 , $0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ の実証試験用試料を測定し、汚染の検出の可否を確認する。

上記の方法を検出器 ch.1～4 で各 10 回実施した。

2 実証試験用試料

実証試験を実施するにあたり、表 1 及び図 1 に示す実証試験用試料（表面汚染密度の模擬サンプル）を作製した。

(1) 作製方法

- ① 放射性物質を含む液体を Ge 半導体検出器付波高分析装置を用いて、放射エネルギーを定量する。
- ② 定量した放射エネルギーを基に、ステンレス皿 5 枚で表 1 に示す表面汚染密度となるように液体をステンレス皿へ適量分取する。
- ③ ステンレス皿に分取した液体を乾固させ、ガスフロー比例計数装置により表面汚染密度を定量し、ステンレス皿 5 枚で表 1 に示す表面汚染密度であることを確認する。
- ④ 定量したステンレス皿 5 枚を配置した実証試験用試料を作製する。

表 1 実証試験用試料の仕様

試料面積（ステンレス皿 底面）	18.9cm ² ×5 枚=94.5cm ²
表面汚染密度（Bq/cm ² ）※	0.4, 0.6, 0.7, 0.8

※汚染が付着した実証試験用試料を 4 種各 1 枚、汚染が付着していない実証試験用試料を 4 枚製作

図 1 実証試験用試料の外観



3 実証試験結果

(1) GM 管式サーベイメータ及びプラスチックシンチレーション式サーベイメータ (サーベイメータ型)

放射線管理員 10 名による汚染検出率は下表のとおり。(詳細は添付資料 (1) を参照)

●GM 管式サーベイメータ

検出限界値 : 0.65Bq/cm²

表面汚染密度 (Bq/cm ²)	0.6	0.7	0.8
汚染検出率 (%)	90	100	100

●プラスチックシンチレーション式サーベイメータ (サーベイメータ型)

検出限界値 : 0.52Bq/cm²

表面汚染密度 (Bq/cm ²)	0.6	0.7	0.8
汚染検出率 (%)	80	100	100

以上の結果より, 0.8Bq/cm² 及び 0.7Bq/cm² の汚染は, 汚染検出率が 100%となった。検出限界値付近の 0.6Bq/cm² の汚染は, 汚染検出率が 50%程度となると考えられるが, 検出器より発する検出音や検出器の指示針の変動により, 放射線管理員の感覚によって『汚染している』と保守的な判断をする傾向にあることから, 実際の汚染検出率は 50%よりも高くなったと評価する。

(2) プラスチックシンチレーション式サーベイメータ (据置型)

プラスチックシンチレーション式サーベイメータ (据置型) による汚染検出率は下表のとおり。(詳細は添付資料 (2) を参照)

●プラスチックシンチレーション式サーベイメータ (据置型)

【走査速度 : 20mm/秒】

ch.No.	1	2	3	4
検出限界値 (Bq/cm ²)	0.63	0.63	0.64	0.66

ch.No.	1			2		
表面汚染密度 (Bq/cm ²)	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	0.8
汚染検出率 (%)	60	60	100	60	60	100
ch.No.	3			4		
表面汚染密度 (Bq/cm ²)	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	0.8
汚染検出率 (%)	50	50	100	50	60	100

【走査速度：10mm/秒】

ch.No.	1	2	3	4
検出限界値 (Bq/cm ²)	0.48	0.47	0.45	0.49

ch.No.	1				2			
表面汚染密度 (Bq/cm ²)	0.4	0.6	0.7	0.8	0.4	0.6	0.7	0.8
汚染検出率 (%)	50	70	100	100	30	50	100	100
ch.No.	3				4			
表面汚染密度 (Bq/cm ²)	0.4	0.6	0.7	0.8	0.4	0.6	0.7	0.8
汚染検出率 (%)	50	60	100	100	30	50	100	100

以上の結果より、0.8Bq/cm²の汚染は、汚染検出率が100%となった。検出限界値付近の汚染は、概ね汚染検出率の理論値50%程度となったと評価する。

4 添付資料

- (1) GM 管式サーベイメータ及びプラスチックシンチレーション式サーベイメータ（サーベイメータ型）による測定結果
- (2) プラスチックシンチレーション式サーベイメータ（据置型）による測定結果

以 上

添付資料（1）

GM 管式サーベイメータ及びプラスチックシンチレーション式サーベイメータ
（サーベイメータ型）による測定結果

1 GM 管式サーベイメータによる測定結果

BG : 80cpm 検出限界値 : 0.65Bq/cm²

測定員	表面汚染密度 (Bq/cm ²)		
	0.6	0.7	0.8
1	○	○	○
2	○	○	○
3	○	○	○
4	○	○	○
5	○	○	○
6	○	○	○
7	○	○	○
8	○	○	○
9	○	○	○
10	×	○	○
汚染検出率 (%)	90	100	100

○ : 汚染検出, × : 汚染検出せず

2 プラスチックシンチレーション式サーベイメータ（サーベイメータ型）による測定結果

BG : 400cpm 検出限界値 : 0.52Bq/cm²

測定員	表面汚染密度 (Bq/cm ²)		
	0.6	0.7	0.8
1	○	○	○
2	○	○	○
3	○	○	○
4	×	○	○
5	○	○	○
6	○	○	○
7	×	○	○
8	○	○	○
9	○	○	○
10	○	○	○
汚染検出率 (%)	80	100	100

○ : 汚染検出, × : 汚染検出せず

プラスチックシンチレーション式サーベイメータ (据置型) による測定結果

1 走査速度 : 20mm/秒

ch.No.	1	2	3	4
BG 計数率 (cps)	26.9	27.5	27.5	29.5
検出限界値 (Bq/cm ²)	0.63	0.63	0.64	0.66

ch.No.	1			2		
回数	表面汚染密度 (Bq/cm ²)			表面汚染密度 (Bq/cm ²)		
	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	0.8
1	○	×	○	×	×	○
2	×	×	○	○	○	○
3	×	○	○	×	○	○
4	○	○	○	○	○	○
5	○	○	○	×	○	○
6	×	○	○	○	×	○
7	○	○	○	×	○	○
8	○	×	○	○	○	○
9	×	×	○	○	×	○
10	○	○	○	○	×	○
汚染検出率 (%)	60	60	100	60	60	100
ch.No.	3			4		
回数	表面汚染密度 (Bq/cm ²)			表面汚染密度 (Bq/cm ²)		
	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	0.8
1	○	○	○	○	○	○
2	×	○	○	○	×	○
3	×	○	○	×	×	○
4	○	○	○	×	○	○
5	×	×	○	×	×	○
6	○	×	○	×	×	○
7	×	×	○	○	○	○
8	×	×	○	○	○	○
9	○	○	○	×	○	○
10	○	×	○	○	○	○
汚染検出率 (%)	50	50	100	50	60	100

○ : 汚染検出, × : 汚染検出せず

2 走査速度 : 10mm/秒

ch.No.	1	2	3	4
BG 計数率 (cps)	27.2	26.9	29.6	29.4
検出限界値 (Bq/cm ²)	0.48	0.47	0.45	0.49

ch.No.	1				2			
回数	表面汚染密度 (Bq/cm ²)				表面汚染密度 (Bq/cm ²)			
	0.4	0.6	0.7	0.8	0.4	0.6	0.7	0.8
1	×	○	○	○	×	×	○	○
2	○	○	○	○	×	×	○	○
3	○	○	○	○	×	×	○	○
4	○	○	○	○	○	○	○	○
5	×	○	○	○	×	○	○	○
6	×	○	○	○	○	×	○	○
7	○	×	○	○	×	○	○	○
8	×	○	○	○	×	×	○	○
9	○	×	○	○	○	○	○	○
10	×	×	○	○	×	○	○	○
汚染検出率 (%)	50	70	100	100	30	50	100	100
ch.No.	3				4			
回数	表面汚染密度 (Bq/cm ²)				表面汚染密度 (Bq/cm ²)			
	0.4	0.6	0.7	0.8	0.4	0.6	0.7	0.8
1	○	○	○	○	×	○	○	○
2	×	○	○	○	×	○	○	○
3	○	×	○	○	×	×	○	○
4	○	○	○	○	×	○	○	○
5	×	○	○	○	×	○	○	○
6	○	○	○	○	○	×	○	○
7	○	×	○	○	○	×	○	○
8	×	×	○	○	×	○	○	○
9	×	×	○	○	○	×	○	○
10	×	○	○	○	×	×	○	○
汚染検出率 (%)	50	60	100	100	30	50	100	100

○ : 汚染検出, × : 汚染検出せず